

PSA-17 ポスター講演一覧

P-01	オージェ電子分光法とSEM-EDSにおける信号強度および検出深さの加速電圧依存性 吉田 木の美, 島 政英, 堤 建一, 小野寺 浩 日本電子株式会社
P-02	浮遊するダストプラズマ微粒子への炭素コーティング ○陳 天鵬, 井上 雅彦 摂南大学理工学研究科
P-03	XPSデータベースWG活動報告 ○勝見 百合, 園林 豊, 高野 みどり, 吉川 英樹 YKK株式会社, 国立大学法人京都大学, パナソニック株式会社, 国立研究開発法人物質・材料研究機構
P-04	改良ThickogramとARXPSを用いたNi表面酸化物の解析 ○田中彰博, 山下晃司, 野平博司 東京都市大学ナノテクノロジー研究推進センター / (株) アドバンテスト研究所 / 東京都市大学工学部電気電子工学科
P-05	合金中の銅と亜鉛のピーク位置の調査 ○村谷 直紀, 島 政英, 堤 建一, 小野寺 浩 日本電子株式会社
P-06	Active Shirley法を使ったXPSスペクトル分解の自動化アルゴリズムの改良 ○篠塚 寛志, 吉川 英樹, 村上 諒, 仲村 和貴, 陰山 弘典, 田中 博美, 吉原 一紘 物質・材料研究機構, 米子工業高等専門学校, シエンタオミクロン株式会社
P-07	Liイオン薄膜電池材料のArガスクラスターイオンスパッタリングによる深さ方向分析 ○高橋和裕, Adam Roberts, Jonathan Counsell, Alex Pearse 島津製作所, Kratos Analytical, University of Maryland
P-08	TOF-SIMSにおける定量性の基礎検討 ○永富 隆清, 伊藤 博人, 飯田 真一 旭化成, コニカミルタ, アルバック・ファイ
P-09	ToF-SIMS測定におけるエンケファリンとDOPCのマトリックス効果評価 ○中野 秀亮, 山嵜 崇之, 岩井 秀夫, 青柳里果 成蹊大学, 立研究開発法人 物質・研究材料機構
P-10	MALDI-TOFMSによる非導電性基板上の有機物の質量分析 ○佐藤貴弥, 島政英, 堤健一, 小入羽 祐治 日本電子株式会社
P-11	MS/MSを搭載したTOF-SIMSによる未知試料の高精度スペクトル解析 ○飯田 真一, H. Y. Cheng, G. L. Fisher, 宮山 卓也 アルバック・ファイ株式会社
P-12	TOF-SIMSデータ解析への機械学習の応用 ○石倉 航, 高橋 一真, 中野 秀亮, 山嵜 崇之, 青柳 里果 成蹊大学物質生命理工学科
P-13	TOF-SIMSデータのImage fusion とピクセル削減による高感度評価 ○高橋 一真, 山岸 崇之, 青木 弾, 福島 和彦, 青柳 里果 成蹊大学物質生命理工学科, 名古屋大学大学院生命農学研究科
P-14	飛行時間型二次イオン質量分析を用いた線虫の生体分子分布評価 ○野瀬美乃里, 山嵜崇之, 木村芳滋, 青柳里果 成蹊大学理工学部, 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部
P-15	飛行時間型二次イオン質量分析を用いたイオン液体中のペプチド構造評価 勝又 理紗子, 山嵜崇之, 岩井秀夫, 青柳里果 成蹊大学理工学部, NIMS
P-16	毛髪ダメージにおける生体分子変化の評価 ○直江 有佳里, 山嵜崇之, 岩井秀夫, 青柳里果 成蹊大学, NIMS